

01; 04; 06; 09; 10; 11; 12

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В СВЧ ПЛАЗМОТРОНЕ С ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Ю. В. Гуляев, И. Д. Черкасов, Р. К. Яфаров

Исходя из дифференциального уравнения диффузии электронов во внешнем магнитном поле, определены концентрация и специфика пространственного распределения электронов в диэлектрическом цилиндре-реакторе установки СВЧ вакуумно-плазменного травления. Исследованы стационарные режимы горения плазмы, его устойчивости. На основании формулы для концентрации электронов приведены решения некоторых практических задач в обеспечении оптимизации технологического процесса СВЧ вакуумно-плазменного травления микроструктур.

Представлено физическое описание процессов, имеющих актуальное техническое применение в разработке и создании современного оборудования микроэлектроники.

Введение

Прогресс микроэлектроники связан с получением предельно высокого быстродействия аппаратуры, уменьшением размеров отдельных элементов электронных функциональных схем и соответственно с увеличением плотности их упаковки [1]. Основным технологическим процессом, определяющим этот прогресс, является литография. Перспективным методом в литографическом процессе создания устройств функциональной электроники с субмикронными размерами элементов является СВЧ вакуумно-плазменное травление (ВПТ) с электронно-циклотронным резонансом [2]. Достоинствами метода являются чистота и мягкость режимов обработки полупроводниковых структур при высокой анизотропности и селективности травления. Это обеспечивается созданием и стабильным поддержанием СВЧ газового разряда при давлениях химически активных газов на 2—3 порядка меньше, чем в существующих промышленных установках с ВЧ возбуждением разряда. При СВЧ ВПТ во внешнем магнитном поле при давлении $1-5 \cdot 10^{-2}$ Па плазма является разреженной и низкотемпературной, а в силу ее неизотермичности основной энергетической компонентой являются электроны, которые определяют состав и концентрацию химически активных частиц, ответственных за травление материалов. В настоящей работе определена концентрация и специфика пространственного распределения электронов в диэлектрическом цилиндре-реакторе установки СВЧ ВПТ при учете влияния на процессы переноса диффузии и дрейфа электронов во внешнем магнитном поле и решены некоторые практические задачи на основе полученной формулы для концентрации электронов (см. рисунок).

Уравнение диффузии электронов в цилиндрическом реакторе с продольным внешним магнитным полем

Пусть $\mathbf{r}=(x, y, z)'$ есть радиус-вектор точки диэлектрического цилиндра Ω , где $\rho=(x^2+y^2)^{1/2}$, тогда

$$\Omega = \{r : \rho \leq R, 0 \leq z \leq h\}. \quad (1)$$

Здесь ρ есть расстояние точки r до оси цилиндра $x=y=0$.

В начале координат $x=y=z=0$ расположим источник нейтральных частиц рабочего газа (водород, азот, хладон или их смесь в соответствующей пропорции). Через t, τ, s будем обозначать моменты времени, причем $t, \tau, s \in R_+ = [0, \infty)$, $v=(v_x, v_y, v_z)'$ есть вектор скорости рассматриваемой частицы, штрих означает операцию транспонирования вектора (или матрицы), $E=(E_1, E_2, E_3)'$, $H=(H_1, H_1, H_3)'$ — векторы напряженностей электрического и магнитного полей соответственно в точке r в момент времени t , $E_j=E_j(t, r)$, $H_j=H_j(t, r)$ ($j=1, 2, 3$). Индексы 1, 2, 3 иногда будем ставить вместо индексов x, y, z соответственно, например $v_x=v_1$, $E_2=E_y$ и т. д.

Если p — круговая частота СВЧ поля (в экспериментах $p \approx 2.375$ ГГц), то компоненты векторов E, H , соответствующие изображенной на рисунке схеме установки, имеют вид

$$\begin{aligned} E_k &= E_{k0} R_e \exp [i(\alpha_k + pt)], \\ H_k &= H_{k0} R_e \exp [i(\alpha_k^M + pt)] + \delta_k^3 H_0(z), \end{aligned} \quad (2)$$

где $k=1, 2, 3$; $\delta_k^l=0$ при $k \neq l$ и $\delta_k^l=1$ при $k=l$. При этом H_0 есть z -компонента магнитного поля, направленного по оси цилиндра Ω .

Плазма образуется под влиянием постоянного магнитного и СВЧ полей в результате возникновения безэлектродного тлеющего разряда. Давление

рабочего газа в плазмотроне поддерживается в пределах 0.01—10 Па. Обозначим через $v_2=v_2(t, p, z)$ скорость потока молекул рабочего газа в Ω (которая может быть найдена экспериментально по расходу газа и по измерениям давления в плазмотроне). Пусть $m, v=(v_1, v_2, v_3)'$ — масса и скорость электрона соответственно. Если $n_0=n_0(t)$ — полное число электронов в Ω в момент времени $t \in R_+$, $f(t, r, \varepsilon)$ — нормированная функция распределения электронов по энергиям, а $f^*(t, \varepsilon)$ — ее среднее значение по Ω , то можем написать [3]

$$f_\varepsilon(t, r, \varepsilon) = n(t, r) f(t, r, \varepsilon), \quad \int \varepsilon^{1/2} f(t, r, \varepsilon) d\varepsilon = 1, \quad (3)$$

$$n(t, r) = \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} f_\varepsilon(t, r, \varepsilon) d\varepsilon, \quad n_0(t) = \int_\Omega n(t, r) dr,$$

$$f^*(t, \varepsilon) = \frac{1}{n_0(t)} \int_\Omega f_\varepsilon(t, r, \varepsilon) dr. \quad (4)$$

Обозначим через ν эффективную частоту столкновений электронов с молекулами газа, через $q(\nu)$ — сечение столкновения с передачей импульса, а через W — скорость дрейфа электронов в плазмотроне, $W=(W^1, W^2, W^3)'$. Пусть D, D_l — коэффициенты поперечной и продольной диффузии электронов, а ν_i, ν_r — усредненные по скоростям частоты столкновений, содействующих ионизации и рекомбинации электронов. Для нахождения концентрации $n(t, r)$ в данной работе применяется уравнение Фоккера—Планка с определенными граничными и начальными условиями.

Если считать диэлектрическую подложку находящейся под плавающим потенциалом, а металлическую подложку — под плавающим потенциалом или заземленной, то уравнение Фоккера—Планка с начальными и краевыми условиями принимает следующий вид:

$$\partial_0 n + W' \nabla n = D \Delta_{\perp} n + D_{\parallel} \partial_{zz} n + (v_z - v_a) n, \quad (5)$$

$$n(0, x, y, z) = \tilde{n}(x, y, z) \quad n(t, x, y, 0) = 0,$$

$$n(t, x, \sqrt{R^2 - x^2}, z) = 0, \quad n(t, x, y, h) = n^*(t, \rho), \\ t \in R_+, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad n^*(t, R) = 0. \quad (6)$$

Построение коэффициентов уравнения диффузии и условие потенциальности поля скоростей дрейфа

Обозначим через $f_0(t, r, \varepsilon)$ изотропную часть нормированной функции распределения электронов по энергиям и будем считать, что коэффициенты диффузии определяются в основном столкновениями и постоянным магнитным полем. Тогда с применением результатов [3] можно будет написать

$$D = \frac{2}{3m} \int_0^{\infty} \frac{v \varepsilon^{3/2}}{v^2 + |\omega|^2} f^*(t, \varepsilon) d\varepsilon, \\ D_{\parallel} = \frac{2}{3m} \int_0^{\infty} \frac{1}{v} \varepsilon^{3/2} f^*(t, \varepsilon) d\varepsilon, \quad (7)$$

где введено обозначение $\omega = -(e/m) H_0$, а f^* — усреднение f_0 по цилиндру Ω . Для дальнейшего введем обозначения

$$\beta_k = \arctg \left\{ \left[\int_0^{\infty} \frac{v \varepsilon^{3/2}}{v^2 + (p - k|\omega|)^2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon \right]^{-1} (p - k|\omega|) \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{3/2}}{v^2 + (p - k|\omega|)^2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon \right\},$$

$$|I_k| = \frac{2}{3} \left\{ \left[\int_0^{\infty} \frac{v \varepsilon^{3/2}}{v^2 + (p - k|\omega|)^2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon \right]^2 + \right. \\ \left. + \left[\int_0^{\infty} \frac{(p - k|\omega|) \varepsilon^{3/2}}{v^2 + (p - |\omega|k)^2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon \right]^2 \right\}^{1/2} \frac{1}{1 + |k|},$$

$$\mu_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ -k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - |k| \end{pmatrix}, \quad I_k = |I_k| e^{-i\beta_k}, \quad k = -1, 0, 1,$$

$$\mu = \frac{l}{m} \sum_{k=-1}^1 I_k \mu_k. \quad (8)$$

Матрица μ называется матрицей комплексной подвижности.

Пусть по обозначению $E_k = E_{0k} \cos(pt + \alpha_k)$, $|E_k| = E_{0k} \exp(i\alpha_k)$ — комплексная амплитуда, $|E_k|^*$ — комплексно сопряженная ей величина, тогда $E_k = = R_e[|E_k| \exp(ipt)]$, где $k = 1, 2, 3$. Если считать, что $\tilde{E}_k = E_{0k} \exp(-ipt)$ и вектор дрейфа в основном определяется СВЧ полем E и постоянным магнитным полем H_0 , то можно написать

$$W = R_e(\mu \tilde{E}). \quad (9)$$

Пусть для определенности

$$E_1 = E_0 \cos(\alpha + pt), \quad E_2 = E_0 \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2} + pt\right),$$

$$E_3 = 0, \quad H_0(z) = H_0 = \text{const.}$$

При этом из (9) получаем

$$W_x = \frac{2e}{m} E_0 |I_1| \cos(\alpha + pt - \beta_1),$$

$$W_y = \frac{2e}{m} E_0 |I_1| \sin(\alpha + pt - \beta_1),$$

$$W_z = 0. \quad (10)$$

В общем случае из (9) находим ($\alpha_k = \alpha$)

$$W_1 = \frac{e}{m} R_e \{ [I_{-1}(E_1 - iE_2) + I_1(E_1 + iE_2)] \exp[i(\alpha + pt)] \},$$

$$W_2 = \frac{e}{m} R_e \{ [I_{-1}(E_2 + iE_1) + I_1(E_2 - iE_1)] \exp[i(\alpha + pt)] \},$$

$$W_3 = \frac{e}{m} |I_0| E_{03} \cos(\alpha + pt - \beta_0). \quad (11)$$

В дальнейшем будем рассматривать тот случай, когда существует скалярный потенциал φ векторного поля скоростей дрейфа W , нормированного на диффузию. Точнее говоря, при обозначениях $D_1 = D_2 = D$, $D_3 = D_e$ потенциал φ должен удовлетворять уравнению

$$\nabla\varphi = +2^{-1}(D_1^{-1}W_1, D_2^{-1}W_2, D_3^{-1}W_3). \quad (12)$$

Условие потенциальности заключается в выполнении следующих равенств:

$$D_m \partial_m W_k = D_k \partial_k W_m, \quad k, m = 1, 2, 3. \quad (13)$$

Потенциал φ не является единственным, поэтому, следуя [4], наложим на него дополнительное условие (калибровку)

$$\begin{aligned} \partial_0 \varphi + (v_\alpha - v_i) - \sum_{1 \leq k \leq 3} (D_k [\partial_k^2 \varphi + (\partial_k \varphi)^2] - W_k \partial_k \varphi), \\ \partial_0 = \partial/\partial t, \quad \partial_1 = \partial/\partial x \text{ и т. д.} \end{aligned} \quad (14)$$

На основании (12) это условие принимает вид

$$\begin{aligned} \partial_0 \varphi = v_i - v_\alpha + \sum_{k=1}^3 \{ (-2D_k)^{-1} (W_k)^2 + (2D_k)^{-2} (W_k)^2 D_k - 2^{-1} \partial_k W_k \} = \\ = v_i - v_\alpha - \sum_{1 \leq k \leq 3} \left[\frac{1}{4D_k} (W_k)^2 + \frac{1}{2} \partial_k W_k \right]. \end{aligned}$$

Учитывая $\partial_m \partial_0 \varphi = \partial_0 \partial_m \varphi$, теперь можем записать еще одно условие существования потенциала с помощью вектора дрейфа

$$-(2D_m)^{-1} \partial_0 W_m = - \sum_{1 \leq k \leq 3} \left[\frac{1}{2D_k} W_k \partial_m W_k + \frac{1}{2} \partial_{km} W_k \right],$$

$$\partial_0 W_m = D_m \sum_{k=1}^3 (\partial_{km} W_k + D_k^{-1} W_k \partial_m W_k), \quad m = 1, 2, 3. \quad (15)$$

Таким образом, если выполнены условия (13), (15), то потенциал скоростей дрейфа находится из равенства

$$\varphi(t, r) = \varphi(0, 0) + \int_L (\partial_0 \varphi) ds + (\nabla' \varphi) d\bar{r}, \quad (16)$$

где L есть кусочно-гладкая кривая в $R_+ \times \Omega$, соединяющая точку $(0, 0)$ с точкой (t, r) ; $r = (x, y, z)$; $d\bar{r} = (dx, dy, dz)'$.

**Концентрация электронов
при постоянном векторе дрейфа
и условие стационарности газового разряда в плазмотроне**

Запишем выражение для концентрации $n(t, r)$, считая $n^* = 0$, при условии существования потенциала скоростей дрейфа. Для этого через $\mu_0^{(n)}$ обозначим n -й корень функции Бесселя нулевого порядка $J_0(x)$ и положим

$$k_{mn} = [D(R^{-1}\mu_0^{(n)})^2 + D_i(h^{-1}m\pi)^2]^{1/2}. \quad (17)$$

Теперь концентрация принимает вид

$$n(t, r) = e^{\varphi(t, r)} \sum_{m, n=1}^{\infty} \mathcal{B}_m^{(n)} J_0(\mu_0^{(n)} \rho R^{-1}) \sin(h^{-1}m\pi z) e^{-k_{mn}^2 t}, \quad (18)$$

причем постоянные $\mathcal{B}_m^{(n)}$ определяются исходя из начального условия $n(0, r) = n_0(r)$.

Если перейти к эффективному электрическому полю и найти постоянный вектор эффективного дрейфа, считая постоянными коэффициенты диффузии, то можно получить один важный в практическом отношении результат. В лабораторной системе координат уравнение (5) принимает следующий вид:

$$\partial_0 n + (W_1 \partial_1 + W_2 \partial_2 + v_r \partial_3) n = [D \Delta_{\perp} + D_i \partial_z^2 + (v_i - v_a)] n. \quad (19)$$

Условия потенциальности вектора дрейфа (13), (15) выполняются, и для построения потенциала φ можно применить формулу (16). Для этого на основании (12), (14) запишем

$$\partial_m \varphi = \frac{1}{2D_m} W_m, \quad m = 1, 2, 3,$$

$$\partial_0 \varphi = v_i - v_a - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^3 \frac{1}{D_k} (W_k)^2.$$

Следовательно, потенциал равен

$$\begin{aligned} \varphi(t, r) = & \left[(v_i - v_a) - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^3 D_k^{-1} (W_k)^2 \right] t + \\ & + \sum_{k=1}^3 (2D_k)^{-1} x_k W_k, \quad W_3 \equiv v_r, \end{aligned} \quad (20)$$

а концентрация дается выражением (18).

Для рассмотрения вопросов устойчивости, стабилизации и существования стационарного режима горения плазмы рассмотрим параметр $k(m, n)$, который естественно назвать коэффициентом распространения диффузионных волн в плазме газового разряда

$$k(m, n) = (v_i - v_a) - k_{mn}^2 - \frac{1}{4} \sum_{1 \leq k \leq 3} (W_k^2 / D_k). \quad (21)$$

Введем три множества пар (m, n)

$$M_{\gamma} = \left\{ (m, n): k(m, n) \begin{cases} < 0 & \text{при } \gamma = -, \\ = 0 & \text{при } \gamma = 0, \\ > 0 & \text{при } \gamma = +, \end{cases} \right\}$$

а также три функции ($\gamma = -, 0, +$)

$$n_{\gamma}(t, r) = e^{\varphi(t, r)} \sum_{(m, n) \in M_{\gamma}} \mathcal{B}_m^{(n)} J_0(\mu_0^{(n)} R^{-1} \rho) \sin\left(\frac{m\pi}{h} z\right) e^{-k_{mn}^2 t}.$$

С помощью множеств M_{γ} можно произвести классификацию режимов горения. Пусть $M = \{(m, n): m, n = 1, 2, \dots\}$ — множество всех пар (m, n) . Если

$M = M_-$, то происходит режим стабилизации газового разряда на его затухание, т. е.

$$n(t, r) = n_-(t, r) + n_0(t, r) + n_+(t, r) \rightarrow 0, \quad (22)$$

когда $t \rightarrow \infty$.

Если $M = M_- + M_0$, то газовый разряд стабилизируется, выходя на стационарный режим

$$n(t, r) \rightarrow n_0(t, r), \quad t \rightarrow \infty, \quad (23)$$

причем считается, что M_0 не является пустым множеством.

Пусть, наконец, множество M_+ также не пустое, т. е. $M = M_- + M_- + M_+$. Тогда газовый тлеющий разряд будет находиться в режиме раскачки диффузионных электронных волн

$$\max_{(\rho, z) \in \mathbb{R}^2} h(t, \rho, z) \rightarrow \infty, \quad t \rightarrow \infty. \quad (24)$$

При стационарном режиме (23) концентрация установившегося процесса горения равна

$$n_0(t, r) = \mathcal{B}_1^{(1)} \exp[(2D)^{-1}(xW_1 + yW_2) + (2D_i)^{-1}z v_r] \times \\ \times \left(\sin \frac{\pi}{h} z \right) J_0(\mu_0^{(1)} R^{-1} \sqrt{x^2 + y^2}). \quad (25)$$

Утверждение, что M_+ — пустое множество, $(1, 1) \in M_0$, является условием устойчивости стационарного режима горения плазмы с концентрацией (25).

Применение некоторых из полученных формул и их связь с экспериментом

1. Применим формулу (25) для нахождения точки z_0 на оси плазменного цилиндра, в которой концентрация электронов максимальна. Для этого введем обозначения

$$n_0^{(1)}(x, y) = \mathcal{B}_1^{(1)} \exp[(2D)^{-1}(xW_1 + yW_2)] J_0(\mu_0^{(1)} R^{-1} \rho), \\ n_0^{(2)}(z) = \exp[(2D_i)^{-1}z v_r] \sin\left(\frac{\pi}{h} z\right).$$

Так как $n_0(t, r) = n_0^{(1)}(x, y) n_0^{(2)}(z)$, то для решения поставленной задачи достаточно исследовать на экстремум функцию $n_0^{(2)}(z) \equiv \Phi(z)$. Если для краткости положить $\alpha = (2D_i)^{-1} v_r$, то получим

$$\Phi'(z) = e^{\alpha z} [\alpha \sin(\beta z) + \beta \cos(\beta z)], \\ \Phi''(z) = e^{\alpha z} [(\alpha^2 - \beta^2) \sin(\beta z) + 2\alpha\beta \cos(\beta z)].$$

Ясно, что при $\alpha = 0$ точкой максимума будет $z_0 = h/2$, поэтому в дальнейшем будем считать, что $\alpha > 0$, т. е. $v_2 > 0$. Таким образом, точка, подозрительная на максимум, находится из уравнения $\Phi'(z) = 0$, т. е. при $\beta = \pi/h$

$$\alpha \sin \beta z = -\beta \cos \beta z, \quad -(\alpha/\beta) = \text{ctg}(\beta z).$$

В точке z_0 , подозрительной на максимум, вторая производная равна

$$\Phi''(z_0) = -(\alpha^2 + \beta^2) \Phi(z_0) < 0, \quad 0 < z_0 < h.$$

Следовательно, в точке

$$z_0 = \frac{h}{\pi} \left(\pi - \text{arctg} \frac{2D_i \pi}{v_2 h} \right) \quad (26)$$

концентрация электронов максимальна. Концентрация электронов в поперечном сечении цилиндра Ω с координатой $z = z_0$ равна

$$n(t, x, y, z_0) = n_0^{(1)}(x, y) n_0^{(2)}(z_0). \quad (27)$$

Из (26) следует, что $z_0 = h/2$ при $v_r = 0$ и $z_0 \rightarrow h$ при $v_r \rightarrow \infty$.

2. Рассмотрим задачу об экспериментальном определении коэффициента диффузии. Для этого применим главный член ряда (18), когда справедливо равенство (20), считая $x=y=0$,

$$n(t, 0, 0, z) = \mathcal{E}_1^{(1)} \exp \left\{ [v_i - v_a] - \frac{1}{4} \left[\sum_{1 \leq k \leq 3} D_k^{-1} (W_k)^2 \right] t \right\} \times \\ \times J_0(0) \sin \left(\frac{\pi}{h} z \right) \exp \left\{ \frac{z}{2D_i} v_2 - \left[D (R^{-1} \mu_0^{(1)})^2 + D_i \left(\frac{\pi}{h} \right)^2 \right] t \right\}.$$

Возьмем два момента времени t_1, t_2 при $0 < t_1 < t_2$ и при фиксированном z обозначим

$$\alpha_j = n(t_j, 0, 0, z), \quad \beta = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \frac{\alpha_1}{\alpha_2}, \quad j = 1, 2.$$

Элементарные (но достаточно громоздкие) вычисления приводят к уравнению

$$\left[(R^{-1} \mu_0^{(1)})^2 + \left(\frac{\pi}{h} \right)^2 \Delta \right] D^2 + (v_a - v_i - \beta) D + \frac{1}{4} \left[W_x^2 + W_y^2 + \left(\frac{v_2}{\Delta} \right)^2 \right] = 0, \quad (28)$$

где $\Delta = D^{-1} D_i$ считается известным числом, $\Delta > 0$.

По физическому смыслу задачи корни уравнения (28) должны быть положительными и одинаковыми. Иначе говоря, при известном векторе дрейфа, известных коэффициентах ионизации и рекомбинации будем считать, что

$$(v_a - v_i - \beta)^2 = \left[(R^{-1} \mu_0^{(1)})^2 + \Delta \left(\frac{\pi}{h} \right)^2 \right] \times \left[W_1^2 + W_2^2 + \left(\frac{v_2}{\Delta} \right)^2 \right].$$

Тогда коэффициенты диффузии будут равны

$$D = \frac{1}{2} \left[(R^{-1} \mu_0^{(1)})^2 + \left(\frac{\pi}{h} \right)^2 \Delta \right]^{-1} (v_i + \beta - v_a), \\ D_i = 0.5 \left[(R^{-1} \mu_0^{(1)})^2 + \Delta \left(\frac{\pi}{h} \right)^2 \right]^{-1} (v_i + \beta - v_a) \Delta.$$

Частный случай этого метода рассмотрен в [3, с. 171, 463], где считается, что

$$\Delta = 1, \quad v_r = W_1 = W_2 = 0, \quad v_i = v_a = 0,$$

а вместо концентрации берется полное число электронов в Ω .

3. Рассмотрим задачу о нахождении энергии, поглощенной электронами, заключенными в Ω . Для этого надо применить формулы (3), (4), (18) и (20). В результате получим

$$\mathcal{E} = \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} \int_\Omega f_e(t, r, \varepsilon) dr d\varepsilon = \int_\Omega n(t, r) \left[\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} f(t, r, \varepsilon) d\varepsilon \right] dr.$$

Найдем в качестве примера количество энергии, поглощенной электронами плазмы для стационарного режима (25) при малой скорости дрейфа $W \approx 0$. Для этого применим распределение Максвелла

$$f(\varepsilon) = A \exp(-\varepsilon/kT_e), \quad A = \text{const}, \quad T_e = \text{const}, \quad v = \text{const}, \quad g \approx c^{-1}.$$

Здесь $(3/2) \cdot T_e k$ есть средняя энергия электрона, T_e называется электронной температурой, а постоянная $A = 2 [\pi (kT_e)^3]^{-1/2}$, k — константа Больцмана. Так как имеем

$$\int_0^h \sin \left(\frac{\pi}{h} z \right) dz = 2h/\pi,$$

$$\int_0^{\infty} \varepsilon^{3/2} 2 [\pi (kT_e)^3]^{-1/2} \exp(-\varepsilon/T_e k) d\varepsilon = (3/2) T_e k,$$

то на основании (25) получим

$$\mathcal{E} = (3\mathcal{B}_1^{(1)}/2) T_e (2h/\pi) Bk,$$

$$B = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} J_0(\mu_0^{(1)} R^{-1} \sqrt{x^2+y^2}) dx dy = 2\pi (R/\mu_0^{(1)})^2 \int_0^{\mu_0^{(1)}} x J_0(x) dx.$$

Окончательно получаем выражение

$$\mathcal{E} = 6h T_e \mathcal{B}_1^{(1)} k \left(\frac{R}{\mu_0^{(1)}} \right)^2 \int_0^{\mu_0^{(1)}} x J_0(x) dx.$$

Из (9), (21), (25) видно, что при $p \approx \omega$ наблюдается резонансное явление усиленного поглощения энергии электронами в стационарном режиме горения плазмы (циклотронный резонанс).

4. Рассмотрим вопрос о допустимой зоне травления микроструктур, считая, что при ослаблении концентрации в α раз по сравнению с концентрацией электронов на оси цилиндра мы попадаем в недопустимую зону (будет нарушена равномерность обработки материалов). Пусть $z=z_0$ — фиксированное число, $n_0 \in [0, h]$, $n_0 = n(0, 0, z_0)$ — концентрация электронов на оси цилиндра, $n = n(x, y, z_0)$ — стационарная концентрация в точке (x, y) поперечного сечения цилиндра.

$$\Omega(z_0) = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, z = z_0\}.$$

Тогда допустимая область травления характеризуется неравенством $n_0/n \leq \alpha$, а граница допустимой области G определяется из уравнения $n_0 = \alpha n$, где $\alpha = \text{const} > 1$, α — данное число.

Для решения этой задачи применим формулу (18), считая, что при $t \rightarrow \infty$ $\varphi(t, r) = k_{11}^2 t + \varphi_1(t, \rho, z)$, $\varphi_1(t, \rho, z) \rightarrow \varphi_2(\rho, z)$, где φ_2 — непрерывная функция в цилиндре Ω . Для радиуса области G теперь имеем уравнение

$$\alpha e^{\varphi_2(\rho, z_0)} J_0(R^{-1} \rho \mu_0^{(1)}) = e^{\varphi_2(0, z_0)} J_0(0).$$

В частности, для потенциала вида (20) при $W_1 = W_2 = 0$ имеем уравнение

$$J_0(\beta) = \alpha^{-1} J_0(0), \quad \rho = R\beta [\mu_0^{(1)}]^{-1},$$

легко решаемое с применением таблиц функций Бесселя.

5. Решим, наконец, следующую задачу. Найти точки z_1, z_2 на оси z такие, что $0 \leq z_1 < z_0 < z_2 \leq h$, где z_0 находится по формуле (26), для которых выполняется неравенство

$$n_0(t, x, y, z_0)/n_0(t, x, y, z) \leq \alpha, \quad z_1 \leq z \leq z_2.$$

Такие точки дают область наиболее эффективного травления при использовании для этого соответствующей зоны плазмотрона.

Для решения задачи следует найти два корня трансцендентного уравнения

$$[\sin(h^{-1}\pi z)] \exp[(2D_I)^{-1} v_r z] = \frac{2\pi D_I}{\alpha [(v_r h)^2 + 4(\pi D_I)^2]^{1/2}} e^{\frac{z_0 \varphi_2}{2D_I}}.$$

В частности, при $v_r = 0$ получим два корня, равные

$$z_1 = \pi^{-1} h \arcsin(\alpha^{-1}), \quad z_2 = h - z_1, \quad \alpha = \text{const} > 1.$$

Прежде всего из формулы для поперечного коэффициента диффузии D видно, что внешнее магнитное поле сильно влияет на процесс поперечной диффузии. С увеличением поля коэффициент D уменьшается, поток электронов становится более равномерным в поперечном сечении цилиндра, а их потери на стенках уменьшаются. Аналогичные выводы приведены в [5, с. 154].

Из (8), (9) заключаем, что амплитуда высокочастотного поперечного дрейфа может быть управляема выбором внешнего магнитного поля: при его сильном возрастании ($|\omega| \rightarrow \infty$) дрейф исчезает, ибо $I \rightarrow 0$. Это приводит к тому, что (при фиксированном D) концентрация электронов, выражаемая формулой (25), становится симметричной относительно оси цилиндра. Напротив, при отсутствии H_0 диффузия возрастает, дрейф становится неуправляемым и нарушается симметрия концентрации электронов в поперечном сечении реактора, т. е. ухудшается равномерность обработки микроструктур по площади.

Следует еще отметить, что явная формула для концентрации (18) может быть применена при вычислении коэффициентов поглощения, отражения и прохождения электромагнитных волн, которые изучены в [6].

Литература

- [1] Гуляев Ю. В. // УФН. 1984. Т. 144. С. 475—495.
- [2] Яфаров Р. К. // Тез. докл. IV Всесоюзн. симп. по плазмохимии. Днепропетровск, 1984. Т. 1. С. 138—139.
- [3] Хаксли Л., Кромптон Р. Диффузия и дрейф электронов в газах. М.: Мир, 1977. 672 с.
- [4] Serkasov I. D. // Soviet Math. Dokl. 1981. Vol. 23. N 1. P. 134—137.
- [5] Мак-Дональд А. Сверхвысокочастотный пробой в газах. М.: Мир, 1969. 212 с.
- [6] Батанов Г. М. // Тр. ФИАН. 1985. Т. 160. С. 174—203.

Институт радиотехники
и электроники АН СССР
Саратовский филиал

Поступило в Редакцию
19 февраля 1988 г.